Высокоэффективные термоэлектрические материалы *n*-(Bi, Sb)₂Te₃ для температур ниже 200 К

© В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 3 ноября 1999 г. Принята к печати 9 ноября 1999 г.)

Рассматривается возможность использования твердого раствора $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ *n*-типа в термоэлектрических охладителях при T < 200 К. Показано, что в рассматриваемом материале, оптимизированном для указанной области температур, наблюдается ослабление температурной зависимости коэффициента термоэдс α и уменьшение теплопроводности кристаллической решетки κ_L по сравнению с традиционным твердым раствором *n*-Bi₂Te_{3-y}Se_y. Эти факторы и высокая подвижность носителей заряда μ_0 приводят к возрастанию параметра $\beta \sim ZT$, где Z — термоэлектрическая эффективность.

Твердые растворы *n*-типа $Bi_2Te_{3-y}Se_y$, (0 < $y \le 0.3$), которые широко используются при температурах, близких к комнатной, обычно применяются и при более низких температурах (T < 200 K). Для области низких температур оптимальная концентрация носителей заряда обеспечивается за счет введения сверхстехиометрического Те [1-3]. Этот способ легирования позволяет исключить дополнительное рассеяние носителей, возникающее при низких температурах при введении галогенидов металлов. Дальнейшее уменьшение рассеяния носителей заряда возможно в системе *n*-Bi_{2-x}Sb_xTe₃ (0 < x < 0.5), поскольку атомы Sb близки по размерам к атомам Ві и поэтому вносят минимальные изменения параметров кристаллической решетки в квазибинарные сплавы на основе Bi₂Te₃ [4]. Использование более сложныхх сплавов с одновременным замещением атомов в анионной (Te) и катионной (Bi) подрешетках Bi₂Te₃ [1,5] позволило получить материалы *n*-типа, эффективные при комнатной температуре. В работе [2] было показано, что в интервале температур 150 < T < 180 К величина термоэлектрической эффективности Z в твердом растворе $n-\text{Bi}_{2-v}\text{Sb}_v\text{Te}_3$ (y = 0.7-0.8) была выше, чем в традиционно используемом материале n-типа $Bi_2Te_{3-\nu}Se_{\nu}$ (у = 0.3). Таким образом, система твердых растворов *n*-Bi_{2-r}Sb_rTe₃ представляет интерес не только при комнатной, но и при более низких температурах.

В настоящей работе проведено исследование термоэлектрических свойств системы твердых растворов $n-\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ при значениях $x \leq 0.4$ на образцах, полученных методом направленной кристаллизации (вертикального зонного выравнивания). Температурные зависимости коэффициента термоэдс α , электропроводности σ и теплопроводности κ в интервале температур 80–300 К были измерены на образцах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$, содержащих избыток Те или легированных донорной примесью TeI₄ [1].

В твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ при концентрациях носителей, оптимизированных для T < 200 К, параметр мощности $\alpha^2\sigma$ возрастает по сравнению с $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ в образцах, содержащих избыточный Те (рис. 1, кривые *I*, *2*, *6*). Такая зависимость $\alpha^2\sigma = f(T)$ объясняется более высокой электропроводностью σ , а следовательно,

подвижностью в области низких температур в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ по сравнению с $Bi_2Te_{3-y}Se_y$ (рис. 2, кривые *1*, 6).

С ростом концентрации носителей заряда n и при легировании TeI₄ величина $\alpha^2 \sigma$ уменьшается вследствие роста числа рассеивающих центров и дополнительного рассеяния на атомах йода (рис. 1, кривые 3–5).

В твердом растворе $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ наблюдалось ослабление температурной зависимости коэффициента термоэдс α (см. таблицу) при увеличении x от 0.2 до 0.4 (рис. 2, кривые 7, 8). Угловой коэффициент $s_1 = d \ln \alpha/d \ln T$ с ростом x в твердом растворе уменьшается (см. таблицу, рис. 2, кривые 7, 8, 10 и 11) как в образцах, содержащих избыточный Те, так и при легировании TeI₄. Однако в образце, легированном TeI₄, низкая величина электропроводности (рис. 2, кривая 4) приводит к уменьшению параметра $\alpha^2 \sigma$. Таким образом, характер изменения $\alpha^2 \sigma$ с температурой в твердом растворе $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ указывает на возможность повышения произведения ZT, от которого зависит кпд термогенератора или холодильный коэффициент термоэлектрического охлаждающего устройства. Поэтому значительный интерес представля-

Угловые коэффициенты температурных зависимостей $s_1 = d \ln \alpha / d \ln T$, $|s_2| = d \ln (m/m_0)^{3/2} \mu_0 / d \ln T$, $|s_3| = d \ln \mu_0 / d \ln T$, $|s_4| = d \ln \kappa_L / d \ln T$, $|s_5| = d \ln \beta / d \ln T$ в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ для температур < 200 К

$Bi_{2-x}Sb_xTe_3 + Te$						
x	$n, 10^{19} \mathrm{cm}^{-3}$	s_1	<i>s</i> ₂	<i>s</i> ₃	<i>S</i> 4	<i>S</i> ₅
0.2	0.86	0.75	1.71	1.86	0.84	1.53
	0.83	0.77	1.99	1.87	0.92	1.42
0.4	0.84	0.57	1.49	1.54	0.74	1.49
$\mathrm{Bi}_{2-x}\mathrm{Sb}_{x}\mathrm{Te}_{3}+\mathrm{TeI}_{4}$						
0.2	0.76	0.69	1.45	1.51	0.81	1.72
0.4	0.83	0.5	1.64	1.21	0.8	1.66
$Bi_{2-x}Sb_xTe_3 + Te$						
0.3	0.35	0.54	1.71	1.45	0.74	1.53

ет проведение детального анализа параметра

$$ZT \approx \beta = \frac{2(2\pi)^{3/2}}{h^3 e} k_0^{7/2} \left(\frac{m}{m_0}\right)^{3/2} \mu_0 T^{5/2} \kappa_L^{-1}, \quad (1)$$

где *m*, μ_0 , κ_L — эффективная масса плотности состояний, подвижность с учетом вырождения и теплопроводность кристаллической решетки соответственно.

Анализ параметра β проводился для случая изотропного рассеяния носителей заряда, когда время релаксации зависит от энергии в виде степенной функции

$$\tau = \tau_0 E^{r_{\rm eff}},\tag{2}$$

где τ_0 — множитель, не зависящий от энергии; $r_{\rm eff}$ — эффективный параметр рассеяния, учитывающий особенности рассеяния в твердых растворах по сравнению с чисто акустическим механизмом рассеяния [6,7].

Произведение $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ (рис. 3), входящее в (1), было определено из данных по α и σ с учетом $r_{\rm eff}$ по методике, используемой в [8,9] в соответствии с выражениями для концентрации и подвижности носителей заряда, применимыми для полупроводника в области примесной проводимости.

В твердом растворе $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ с избытком Те по сравнению с $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ произведение $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ возрастает при близких величинах угловых коэффициентов $|s_2|$ в образцах с оптимальными концентрациями носителей для T < 200 К (рис. 3, кривые 1, 2, 6). С ростом содержания второго компонента в твердом растворе $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ величина $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ уменьшается (рис. 3, кривые 1, 2, 4 и 5). Легирование TeI₄ приводит



Рис. 1. Температурная зависимость параметра мощности $\alpha^2 \sigma$ в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (*1*–5) и $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ (*6*). *1,3,4* — *x* = 0.2; *2,5* — *x* = 0.4; *6* — *y* = 0.3. *1–3* — избыточный Te, *4,5* — TeI₄.



Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности α (1-6) и коэффициента термоэдс α (7-12) в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ (1-5, 7-11) и $Bi_2Te_{3-y}Se_y$ (6, 12). 1, 3, 4, 7, 9, 10 — x = 0.2; 2, 5, 8, 11 — x = 0.4; 6, 12 — y = 0.3. 1-3, 6-9, 12 — избыточный Те, 4, 10 — TeI₄.



Рис. 3. Температурная зависимость произведения $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (1–5) и $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ (6). Обозначения кривых на рис. 3 и последующих рисунках в соответствии с рис. 1.

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 4

Подвижность с учетом вырождения μ_0 и усредненная эффективная масса плотности состояний m/m_0 были рассчитаны из произведения $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$ в соответствии с [8]. Для определения концентрации носителей заряда была использована концентрационная зависимость термоэдс $\alpha = f(n)$, полученная из данных по гальваномагнитным коэффициентам, измеренным в слабом магнитном поле в твердых растворах Bi₂Te_{3-v}Se_v [9]. Рассчитанные концентрации носителей в оптимизированных для $T < 200 \,\mathrm{K}$ образцах твердого раствора составляли $\sim~0.8\,\cdot\,10^{19}\,\text{см}^{-3}$ и были выше, чем в $Bi_2Te_{3-\nu}Se_{\nu}$ (~ 0.3 · 10¹⁹ см⁻³). Несмотря на различие в концентрациях носителей, подвижности в области низких температур в оптимизированных образцах твердых растворов Bi_{2-x}Sb_xTe₃ и Bi₂Te_{3-y}Se_y отличаются незначительно, как и угловые коэффициенты (см. таблицу, рис. 4, кривые 1, 6). Из сравнения образцов с близкими концентрациями носителей ($n \approx 8 \cdot 10^{19} \, {\rm cm}^{-3}$) при T = 80 К следует, что подвижности в твердом растворе $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ выше ($\mu_0 \approx 6000 \text{ см}^2/\text{B} \cdot \text{c}$), чем в Bi₂Te_{3-v}Se_v ($\mu_0 \approx 4600 \text{ см}^2/\text{B} \cdot \text{c}$), вследствие меньших искажений кристаллической решетки, вносимых атомами Sb по сравнению с атомами Se. С ростом содержания второго компонента х и концентрации *n* в твердом растворе μ_0 уменьшается, как и произведение $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$, вследствие увеличения рассеяния носителей заряда (кривые 1, 2 и 1, 3). При легировании TeI_4 также наблюдается снижение подвижности.



Рис. 4. Температурная зависимость подвижности с учетом вырождения μ_0 в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (*1–5*) и $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ (*6*).

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 4



Рис. 5. Температурная зависимость эффективной массы плотности состояний m/m_0 в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (*1*–5) и $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-v}\text{Se}_v$ (*6*).

В образце $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ (x = 0.2) с высокой подвижностью μ_0 эффективная масса m/m_0 очень слабо зависит от T в области низких температур (рис. 5, кривая 1). При (x = 0.4) наблюдается рост эффективной массы m/m_0 , как и в Bi₂Te_{3-v}Se_v (кривые 2, 6). Увеличение m/m_0 при низких температурах в твердом растворе Ві_{2-х}Sb_xTe₃ для более высоких концентраций носителей заряда, чем в Bi₂Te_{3-v}Se_v, объясняется температурной зависимостью отношений компонентов тензора эффективных масс (m/m_0) в Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y}Se_y в соответствии c [10]. Низкая величина m/m_0 в твердом растворе $Bi_2Te_{3-v}Se_v$, как и высокая подвижность μ_0 , связана с низкой концентрацией носителей заряда по сравнению с $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3}$. С ростом концентрации носителей m/m_{0} увеличивается (рис. 5, кривая 3), что приводит к увеличению произведения $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$. В образце $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ (x = 0.4), легированном TeI₄ (рис. 5), в котором m/m_0 также возрастает при низких Т, низкая подвижность не обеспечивает высоких значений $(m/m_0)^{3/2}\mu_0$.

Данные по теплопроводности κ были использованы для расчета теплопроводности кристаллической решетки κ_L (рис. 6). При определении электронной теплопроводности κ_e расчет числа Лоренца L проводился для r_{eff} :

$$L = \left(\frac{k}{e}\right)^2 \left[\frac{(r+7/2)F_{r+5/2}(\eta)}{(r+3/2)F_{r+1/2}(\eta)} - \frac{(r+5/2)^2F_{r+3/2}^2(\eta)}{(r+3/2)^2F_{r+1/2}^2(\eta)}\right],$$
(3)

где $F_r(\eta)$ — интеграл Ферми вида

$$F_r(\eta) = \int_0^\infty [x^r/e^{x-\eta}] dx.$$
(4)



Рис. 6. Температурная зависимость теплопроводности кристаллической решетки κ_L в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (*1–5*) и $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ (*6*).

Использование $r_{\rm eff}$ при расчетах числа Лоренца L позволяет учесть возможную биполярную диффузию носителей заряда в области температур $T > 250 \,{\rm K}$ с помощью температурной зависимости $r_{\rm eff} = f(T)$ [6,7].

Теплопроводность кристаллической решетки κ_L в твердом растворе $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ с избытком Те при увеличении x от 0.2 до 0.4 уменьшается вследствие увеличения рассеяния фононов на атомах второго компонента. Наиболее низкие величины κ_L и углового коэффициента $|s_3| = d \ln \kappa_L/d \ln T$ наблюдались в образце $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (x = 0.4) (рис. 6, кривая 2), что обеспечивает увеличение параметра β , рассчитанного в соответствии (1), (рис. 7, кривая 2). Низкая κ_L наблюдалась в $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (x = 0.4) и при легировании в TeI_4 (рис. 6, кривая 5). Однако снижение подвижности и более высокий угловой коэффициент $|s_3| = d \ln \kappa_L/d \ln T$ (см. таблицу) по сравнению с образцом, содержащим избыток Те, приводят к уменьшению параметра β (рис. 7, кривая 5).

Увеличение параметра $\beta \sim ZT$ при меньших угловых коэффициентах x_4 (см. таблицу) в твердых растворах в $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$, особенно при x = 0.4, (рис. 7, кривые I, 2) указывает на более высокую термоэлектрическую эффективность по сравнению с $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$. Для $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ при x = 0.4 (Z) = $3.1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ в интервале 80 < T < 200 K (рис. 7, кривая 8). В оптимизированном при T < 200 K твердом растворе $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ соответствующее среднее значение (Z) = $2.85 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ (рис. 7, кривая I2). Следует отметить, что твердые растворы $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (x = 0.4) обладают высокой термоэлектрической эффективностью во всем исследованном интервале температур, так $\langle Z \rangle = 3.3 \cdot 10^{-3} \, \mathrm{K}^{-1}$ при 200 $< T < 300 \, \mathrm{K}$ (рис. 7, кривая 8).

В результате исследования твердых растворов $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ (0.2 < x < 0.4), содержащих избыточный Te, было показано, что в области оптимальных концентраций носителей заряда эти материалы являются перспективными для использования в термоэлектрических охлаждающих устройствах как для интервала температур 80 < T < 200 K так и для 200 < T < 300 K. Возрастание термоэлектрической эффективности Z происходит за счет достижения высокой подвижности μ_0 , роста усредненной эффективной массы плотности состояний m/m_0 в низкотемпературной области и уменьшения теплопроводности кристаллической решетки κ_L .



Рис. 7. Температурная зависимость параметра β (1-6) и термоэлектрической эффективности Z (7-12) в твердых растворах Bi_{2-x}Sb_xTe₃ (1-5, 7-11) и Bi₂Te_{3-y}Se_y (6, 12). 1, 3, 4, 7, 9, 10 — x = 0.2; 2, 5, 8, 11 — x = 0.4; 6, 12 — y = 0.3. 1-3, 6-9, 12 — избыточный Te, 4, 10 — TeI₄.

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 4

Список литературы

- [1] M.H. Ettenberg, W.A. Jesser, F.D. Rossi. Proc. XV Int. Conf. on Thermoelectrics, (Pasadena, CA, USA, 1996) p. 52.
- [2] A.I. Anukhin. Proc. XVI Int. Conf. on Thermoelectrics (Dresden, Germany, 1997) p. 159.
- [3] В.А. Кутасов, М.В. Ведерников, П.П. Константинов, Ю.И. Агеев, Г.Т. Алексеева, Л.Н. Лукьянова, Ю.И. Равич, М.И. Федоров. Письма ЖТФ, 18, 542 (1992).
- [4] Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов, И.А. Смирнов. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi₂Te₃ (М., Наука, 1972).
- [5] W.M. Yim, F.D. Rossi. Sol. St. Electron., 15, 1121 (1972).
- [6] В.А. Кутасов, Л.Г. Лукьянова. ФТТ, **26**, 2501 (1984).
- [7] В.А. Кутасов, Л.Г. Лукьянова. ФТТ, 28, 899 (1986).
- [8] В.А. Кутасов, Л.Г. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ, 41, 187 (1999).
- [9] Г.Т. Алексеева, П.П. Константинов, В.А. Кутасов, Л.Г. Лукьянова, Т.Е. Свечникова, С.Н. Чижевская. ФТТ, 33, 3539 (1991).
- [10] В.А. Кутасов, Л.Г. Лукьянова. ФТТ, 29, 2966 (1987).

Редактор В.В. Чалдышев

High–effective thermoelectrical materials n-(Bi, Sb)₂Te₃ at temperatures less than 200 K

V.A. Kutasov, L.N. Lukjanova, P.P. Konstantinov

Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St.Petersburg, Russia